

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. május 13 –május 19.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8		Sávoly Zoltán nanoszemcsék vizsgálata STEM detektorral VG	Peltier-asztal, környezeti üzemmód fehérjével ellátott C nanocsövek próbamérése VG, BA, DZ	Párolgatott multiréteg minta rétegvastagságának és elemanalízisének vizsgálata FIB BA, VG	Hikari kamera mechanikájánk szervize VG, DZ				
9	Mikroszkóp elektron és ionágyújának beállítása VG								
10									
11									
12									
13									
14	Kalácska Szilvia EBSD próbamérések VG, KSz,	BME, Tóth Ajna fehérjével ellátott C nanocsövek próbamérése BA, VG		Kalácska Szilvia EBSD próbamérések VG, KSz,	AutoFIB program vizsgálata DZ, VG				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna